

○奈良工業高等専門学校物質化学工学科機器分析センター保有機器の利用に関する事務取扱要項

制定 平成29年12月11日

(趣旨)

第1条 この要項は、奈良工業高等専門学校物質化学工学科機器分析センター(以下「センター」という。)が保有する機器(以下「機器」という。)の利用に関する手続きを定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において機器とは、別表1に掲げるものとする。

(利用時間)

第3条 機器の利用時間は、土日祝祭日及び奈良工業高等専門学校(以下「本校」という。)の休業日を除く午前8時30分から午後5時00分までとする。但し、校長が必要であると認めたときは、これを変更することができるものとする。

(利用の申請手続)

第4条 機器の利用を希望する利用者は、あらかじめ機器利用申請書(別記様式1)を提出し、許可を受けなければならない。なお、利用者のうち本校の教職員及び本校と共同研究契約を締結している学外者の利用については、センターが別途設置する利用予約システムへの入力で本様式1の提出に代えることができる。

2 校長は、許可をしたとき、機器利用許可書(別記様式2)により利用者に通知するものとする。

(利用料)

第5条 利用者は、別に定める利用料を納付しなければならない。利用者のうち本校教職員については、予算振替によりセンターに納付するものとする。

2 既に納付した利用料は、返還しない。

3 利用料は、経済情勢の変動その他の事情の変更により改定することができる。

4 本校教職員の学術研究を目的とする機器利用については、原則、利用料を免除する。

5 大学等の研究機関が、民間資金によらない学術研究を目的とし、センターの機器を利用する場合は、利用料を免除することができる。

6 本校と共同研究契約を締結している学外の利用者が、共同研究遂行のためにセンターの機器を利用する場合は、共同研究締結額を考慮の上、利用料を免除することができる。

(利用料の納付)

第6条 利用者は、利用料を本校が指定する方法により利用開始前までに納付しなければならない。但し、校長が、必要と認めた場合、機器の利用料について後納とすることができるものとする。

(利用許可の変更、取り消し等)

第7条 利用者が利用の日時を変更し、又は取り消す場合は、利用開始の前日(本校の休業日を除く。)までに校長に申し出をし、その許可を得なければ

ばならない。

- 2 校長は、次の各号に該当するときは、利用者に対し当該許可を取り消すことができるものとする。
 - 一 許可の条件に違反したとき又はそのおそれがあると認めたとき。
 - 二 申請書に虚偽の記載があったとき。
 - 三 利用料を利用開始前まで納付しないとき。但し、前条但書で後納を認めた場合を除く。
 - 四 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
 - 五 本校において当該機器を利用する必要性が生じたとき。
 - 六 その他センターの管理運営上支障があると認めたとき。
- 3 前項による取消しを行ったことにより利用者が損害を受けても、本校はその責を負わない。

(遵守事項)

第8条 機器を利用できる者は、本校が行う機器の利用に関する講習を受講した者又は必要な技術を有していると校長が認めた者のみとする。

- 2 機器の利用に際しては、原則として校長が指名した者（以下「機器管理担当者」という。）が立ち会う。
- 3 機器の利用に必要な消耗品及び試料等については、原則、全て利用者が負担する。
- 4 利用者は、設備、備品等を破損又は滅失したときは、速やかに現状回復又はその損害を賠償しなければならない。
- 5 利用者は、本校教職員の指示に従うとともに、本校の諸規則を遵守しなければならない。
- 6 利用者は、機器管理担当者が指定した場所以外に許可なく立ち入ることはできない。
- 7 利用者の過失により本人が負傷し、又は疾病にかかった場合、本校は一切責任を負わない。
- 8 利用者は、許可された時間内に後片付けを含む全ての作業を終了しなければならない。
- 9 機器管理担当者は、利用者が機器を取り扱うのに十分な技術を身につけていないと判断したとき及び毒物や機器を破損させる恐れがあるものを測定しようとしたときは、機器の利用を即時中止させることができる。
- 10 センターは、機器の利用で得られたデータに関してその確度を保証しない。
- 11 利用者が機器の利用で得られたデータを公表しようとするときは、本校の名称を使うことはできない。ただし、校長が使用を許可したときは、この限りではない。
- 12 校長の許可を得ずにデータを公表したことにより本校が損害を被った場合は、利用者が賠償しなければならない。
- 13 天災その他やむを得ない事由によって利用が中止又は延期された場合でも、利用者はこれに係る損害請求はできない。
- 14 利用者が機器管理担当者の指示に従わないときは、校長は利用許可を取り消すことができる。

(秘密の保持等)

第9条 センター及び利用者は、機器利用の過程で知り得た双方の情報について、相手方の書面による同意なしに公開してはならない。

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、独立行政法人国立高等専門学校機構各規則によるものとする。

附則

この要項は、平成29年12月11日から施行する。

別記様式1-1

別記様式1-2

別記様式2

別表1

設備名	メーカー名	備考
ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡JSM-7800+ツインEDS検出器(60mm2×2)+透過電子検出器	JEOL製+Thermofisher製+Deben製	
X線光電子分光装置 ESCA 3057特型装置(XPS)+紫外線光電子分光分析装置(UPS)	Ulvac PHI製	
全自動多目的水平X線回折装置 Smart Lab 3K/PD/INP	RIGAKU製	
周波数変調方式走査型プローブ顕微鏡 FM-AFM特型	SHIMADZU製	
NMR 400SS	JEOL製	
LC-MS XevoG2-S Qtof	Waters製	
ツインシーケンシャル形ICP発光分析装置 ICPS-8100	SHIMADZU製	
AFM-STM SPM-9700	SHIMADZU製	
触媒評価装置BELCAT-A	日本ベル製	
自動比表面積/細孔分布測定装置BELSORP-mini	日本ベル製	
熱重量分析装置TG/DTA7200	SII製	
示差走査熱量分析装置X-DSC7000	SII製	
UV-vis UV-3600	SHIMADZU製	
その他()		

別記様式 1-1

校長	事務部長	物品管理役 (総務課長)	課長補佐	契約係長	契約係	担当

(学外用)

機 器 利 用 申 請 書

令和 年 月 日

奈良工業高等専門学校長 殿

住所
所属・氏名
TEL/FAX:

以下の設備機器の使用・分析を申し込みます。

設 備 名	メーカー名	使用時間	備考
ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡JSM-7800+ ツインEDS検出器 (60mm2×2) +透過電子検出器	JEOL製+Thermofisher製+ Deben製		
X線光電子分光装置 ESCA 3057特型装置(XPS)+紫外 線光電子分光分析装置(UPS)	Ulvac PHI製		
全自動多目的水平X線回折装置 Smart Lab 3K/PD/INP	RIGAKU製		
周波数変調方式走査型プローブ顕微鏡 FM-AFM特型	SHIMADZU製		
NMR 400SS	JEOL製		
LC-MS XevoG2-S Qtof	Waters製		
ツインシーケンシャル形ICP発光分析装置 ICPS-8100	SHIMADZU製		
AFM-STM SPM-9700	SHIMADZU製		
触媒評価装置BELCAT-A	日本ベル製		
自動比表面積/細孔分布測定装置BELSORP-mini	日本ベル製		
熱重量分析装置TG/DTA7200	SII製		
示差走査熱量分析装置X-DSC7000	SII製		
UV-vis UV-3600	SHIMADZU製		
その他()			

使用期間：令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

(測定物・測定内容について記述してください。)

【担当者記入欄】

機器使用単価(@) × () 時間 = (円 a)
 附帯消耗品 () × () = (円 b) ※必要に応じて
 間接経費相当分 ((a+b) × 0.1) = (円 c)
 請求額 計 (d=a+b+c) (円 d)

※利用者のうち本校と共同研究契約等を締結している学外の利用についてはセンターが別途設置する利用予約システムへの入力で別記様式1の提出に代えることができる。

別記様式 1-2

校長	事務部長	物品管理役 (総務課長)	課長補佐	契約係長	契約係	担当

(学内用)

機器利用申請書

令和 年 月 日

奈良工業高等専門学校長 殿

所属・氏名 _____

以下の設備機器の使用・分析を申し込みます。

設備名	メーカー名	使用時間	備考
ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡JSM-7800+ ツインEDS検出器 (60mm2×2) +透過電子検出器	JEOL製+Thermofisher製+ Deben製		
X線光電子分光装置 ESCA 3057特型装置(XPS)+紫外 線光電子分光分析装置(UPS)	Ulvac PHI製		
全自動多目的水平X線回折装置 Smart Lab 3K/PD/INP	RIGAKU製		
周波数変調方式走査型プローブ顕微鏡 FM-AFM特型	SHIMADZU製		
NMR 400SS	JEOL製		
LC-MS XevoG2-S Qtof	Waters製		
ツインシーケンシャル形ICP発光分析装置 ICPS-8100	SHIMADZU製		
AFM-STM SPM-9700	SHIMADZU製		
触媒評価装置BELCAT-A	日本ベル製		
自動比表面積/細孔分布測定装置BELSORP-mini	日本ベル製		
熱重量分析装置TG/DTA7200	SII製		
示差走査熱量分析装置X-DSC7000	SII製		
UV-vis UV-3600	SHIMADZU製		
その他()			
使用期間：令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日			
依頼者の振替財源			
(測定物・測定内容について記述してください。)			
【担当者記入欄】 機器使用単価(@)×()時間 = (円 a) 附帯消耗品()×() = (円 b)※必要に応じて 間接経費相当分((a+b)×0.1) = (円 c) 請求額 計(d=a+b+c) (円 d)			

